

テクトロニクス・イノベーション・フォーラム2026

このたびテクトロニクスは、皆さまの長年にわたるご愛顧に支えられ、創立80周年という節目の年を迎えることができました。ともに高みを目指して歩んできたお客様への感謝の気持ちを込め、本イベントでは、日々の業務に役立つ最新技術情報や実機展示に加え、業界動向や今後の産業展望など、将来を見据えるヒントとなる情報をご用意しております。本イベントが、先の見えない時代を切り拓くための一助となれば幸いです。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

取扱代理店

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL: 06-6353-5551	兵庫営業所	TEL: 078-452-3332
京都営業所	TEL: 075-671-0141	姫路営業所	TEL: 079-271-4488
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040	姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040	川崎営業所	TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

開催日時

2026年7月7日 (火)
10:00 - 17:00 開場9:30

会場

赤坂インターシティコンファレンス4F
溜池山王駅/国会議事堂前駅 地下出口直結

無料・登録制
お申し込みはこちら▶



業界を牽引する研究者たちによる特別対談



大阪大学 舟木剛 教授 × 名古屋大学 山本真義 教授

大変革時代のAI×パワエレ戦略
先駆研究者たちが語る業界の未来 ほか



各分野のエキスパートによる講演



大同大学 小島崇 教授
「対症療法から原理に基づく
EMC設計へ - 産学連携コンソー
シアムにおける市販PHEVノイズ
予測の実践と人材育成」



大阪大学 五十嵐浩二 教授
「通信の知能化に伴う計測パラダイ
ムの転換 - 信号から統計性質の
連続観測へ」

AMD Japan AI Innovators Hub
中村 正澄 様

「学習から推論へ、変化する
生成AI市場技術トレンド」



高速シリアル・インタフェース 技術コンサル
タント

畑山 仁 様
「高速シリアル設計の本質と
開発組織に求められる新しい視
点」



実機お試しデモ/エンジニア個別相談/すぐ使えるお役立ちミニセミナー

展示会場では、新製品や最新ソリューションを実機デモで体感いただけます。またオシロスコープ使いこなしテクニックをサクッと学べるミニセミナーや、自動計測の実践ポイントなどもご紹介。皆様の具体的な計測課題やお困りごとなど、ぜひお気軽にご相談ください。

高速通信

PCIe
USB4/3.2
DDR

自動車
カメラ/MIPI
イーサネット

パワー
デバイス
評価

EMC
ノイズ

自動計測

オシロ活用
ミニセミナー

など

AI時代のパワーエレクトロニクス -パワエレエンジニアとAIの共生の道-

大阪大学 舟木剛 教授

Chat GPT, Gemini, co pilotをはじめとするAIが著しく進化していますが、そのAIデータセンターを支えているのが、パワーエレクトロニクスによる電源です。パワーエレクトロニクスの設計においてもAIが活用され始めていますが、果たしてパワーエレクトロニクスエンジニアはAIに取って代わられるのでしょうか。AIが得意とするところ、人間のエンジニアしかできないところを概観し、AIとエンジニアの共生の道を探っていきます。

電動車&データセンター用パワーエレクトロニクス技術の変遷と今後の各分野における技術革新の方向性

名古屋大学 山本真義 教授

これまで技術投資が続いてきた電動車に対して新しく立ち上がってきたデータセンター市場におけるパワーエレクトロニクス技術の概要と現状の技術ボトルネックについて解説する。さらにそれらのパワーエレクトロニクス技術が今後、それぞれに独自進化を遂げていくのか、もしくは融合される可能性はあるのか、についても各電動車の分解解析結果からその技術予測を議論し、2030年に各分野のパワーエレクトロニクス技術がどの様に進化していくかを予測する。

【特別対談】大変革時代のAIxパワエレ戦略 -先駆研究者たちが語る業界の未来-

大阪大学 舟木剛 教授 × 名古屋大学 山本真義 教授

AIの進展とモビリティのデータセンター化が同時進行する中、産業構造は大きな転換期を迎えている。本対談では、パワーエレクトロニクス分野を先駆してきた研究者2人が、AIとモビリティの融合がもたらす技術的・産業的インパクトを多角的に議論する。研究の最前線と実装・応用の視点から、今後の競争軸とモビリティ産業の行方を読み解く。

対症療法から原理に基づくEMC設計へ -産学連携コンソーシアムにおける市販PHEVノイズ予測の実践と人材育成

大同大学 小島崇 教授

部品や回路の性能が最終製品のEMCにどう影響するか。この課題に対し、対症療法ではなく原理に基づく低減設計を目指す新しいアプローチが求められています。同時に、広範な知識を要するEMC人材の育成は一企業では困難であり、外部機関のノウハウ活用が必須です。本講演では、共通の題材でオープンに議論するコンソーシアムの活動を取り上げます。市販PHEV部品のノイズ計測・予測の成果を交え、産業応用を意識したEMC設計思想と人材育成の展望をお話します。

通信の知能化に伴う計測パラダイムの転換 -信号から統計性質の連続観測へ

大阪大学 五十嵐浩二 教授

通信分野における研究開発は、デバイス中心からDSP中心へと大きくシフトしている。さらにDSPは、従来の信号処理にとどまらず、環境や人間との相互作用を含む知能化へと発展しつつある。これに伴い、測定対象は瞬時波形の高速・高精度取得から、長時間にわたる統計的性質の連続的な取得・評価へと拡張される。本講演では、連続観測と統計評価の重要性を示し、デッドタイムレス計測やイベント駆動信号生成など、今後の計測技術の方向性について議論する。

学習から推論へ、変化する生成AI市場技術トレンド -知らなきゃ損する、注目技術を分かりやすく解説

AMD Japan AI Innovators Hub 中村 正澄 様

生成AI市場に要求される技術トレンドを半導体メーカー目線から解説します。チップレット、3Dパッケージ、CPO、AI DCに必要な半導体技術とは？電力問題を解決するワットビット連携とは？注目されがちなAI学習向けのGPUだけでなく、TPU、ネットワーク、ストレージといったAIデータセンターに必要な技術動向をわかりやすく解説します。また、AI DCの今後の課題も明らかにします。

高速シリアル設計の本質と開発組織に求められる新しい視点

高速シリアル・インタフェース技術コンサルタント 畑山 仁 様

高速シリアル設計はPAM4の導入により難易度が大幅に上昇し、従来手法では測定と実動作の乖離や手戻りが発生しやすくなっている。本講演では設計・測定の本質とそのギャップを整理し、組織や人材の観点も含めて、これからの高速シリアル開発に求められる考え方を解説する。

USB3.2/USB4の規格動向とアンリツ&テクトロニクスの最新Tx/Rx計測ソリューション

アンリツ株式会社 多田 哲也 様 / テクトロニクス 鈴木克彦 脇本雄太

USB規格は進化を続け、USB4 V2.0では40Gbps/レーンの高速伝送を実現しています。テクトロニクスではアンリツ社と協業して、USB3.2/USB4に対応した包括的なTx/Rx計測ソリューションを提供します。本セッションではテクトロニクスから、業界最高クラスの有効ビット/低ノイズ性能を持つ最新オシロスコープ714シリーズDPOを用いたUSB3.2/USB4およびUSB Type-Cに関連するDisplayPortのTx計測を紹介し、アンリツ社からは業界最高クラスの性能を誇るBERT MP1900Aを用いたUSB3.2/USB4のRx計測ソリューションを紹介いたします。

PCI Expressの規格動向とアンリツ&テクトロニクスの最新Tx/Rx計測ソリューション

アンリツ株式会社 和田健 様 / テクトロニクス 鈴木克彦

AI、HPC、データセンター市場の拡大を背景に、PCI Expressはさらなる高速化が進み、光技術との融合が注目されています。一方で、その用途は自動車分野を含む幅広い分野へと広がっています。規格団体PCI-SIGではPAM4 128GT/sに対応したPCIe 7.0の標準化が進むとともに、256GT/sに対応するPCIe 8.0の検討も本格化しています。本セミナーでは、PCIeの規格動向を解説するとともに、アンリツ社とテクトロニクスの協業によるPCIe向けTx/Rxトータル計測ソリューションをご紹介します。

LPDDRメモリの最新規格を徹底解説！ 規格・測定・判定を完全把握

テクトロニクス 高橋誠

DDRメモリはLPDDR5とDDR5が主流となり、次世代LPDDR6の規格公開も近づいています。高性能・省電力を目的にLPDDR5を採用するケースが増える一方、規格理解や測定・判定、デバッグの工数や測定ツールの活用が課題です。本セミナーではLPDDR4/5の規格、測定方法、判定方法を具体的に解説します。

パワー・インテグリティの重要性和最新の測定手法

テクトロニクス 池田一樹

パワー・インテグリティ (PI) はSIやEMCと関係し、回路の安定動作に不可欠です。近年基板の小型化により電源は低電圧・大電流・高速化が進み、電源ノイズやインピーダンスの影響が無視できなくなっています。本セミナーでは実測例を交え、最新の電源測定ソリューションを紹介します。

SiC/GaN等の次世代パワーデバイス評価と最新測定ソリューション

テクトロニクス 池田一樹

高性能・省エネルギー化が進む次世代パワーデバイスの評価には、精密なスイッチング特性測定が不可欠です。本セミナーでは、ダブル・パルス・テストと従来手法の課題を整理し、より効率的かつ高精度な評価を可能にする最新の測定ソリューションを実例とともに紹介します。

